

산업인공지능 개론

DECISION TREE 수집 데이터 설명 자료

2020254013

김병근

2021.4.29

1. ESS 제품 제조 공정도(검사장비에 한함)



BMS - PCB 검사 공정

PCB

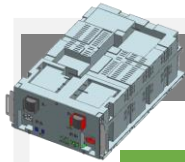
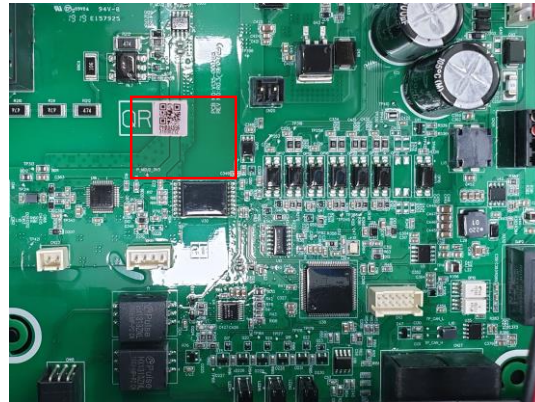
SPI

AOI

ICT

Firmware

Function Test



BMS - PACK 검사 공정

PACK

OCV

IR

AGING

Function Test

치수검사



1. ESS 제품 제조 공정도(검사장비에 한함)

PACK ID JA25AP

- PACK ID 정보

제품 BCU

로트 번호 JA2

R-BMS LOT R00

PCB 공급사

PCB 주자

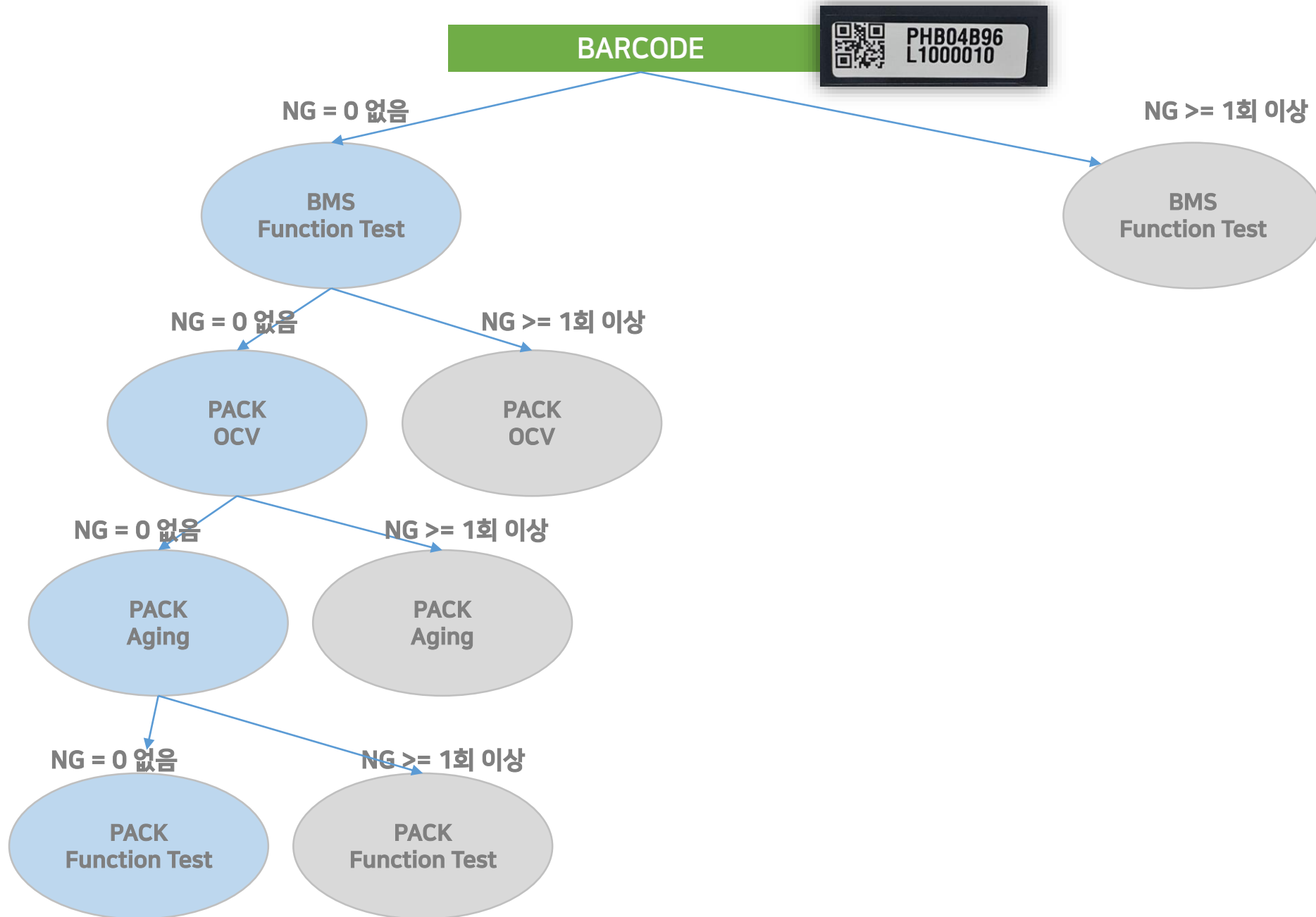
PACK ID 측정결과 원자재 이력정보 BSP1 측정결과 BAO1 측정결과 BICT 측정결과 BFW 측정결과 BFT 측정결과 PFT 측정결과 AG1 측정결과 OCV 측정결과 IR 측정결과 TORQUE 측정결과 SVI 측정결과

- PACK ID 측정결과

장비 그룹	BSP1	BAO1	BICT	BFW	BFT	PFT	AG1	OCV	IR	NUT	SVI
장비	PLOC1-SP101	PLOC1-AOI01	PLOC1-ICT	PLOC1-E4D-R.FW1	PLOC1-E4D-R.BFT1	PLOC1-E4D-PFT1	PLOC1-E4D-AGI1	PLOC1-E4D-OCV1	PLOC1-E4D-IR1	PLOC1-ESS-NUT01	PLOC1-ESS-SVI01
장비명	PLOC1-SP101	AOI 01 (SIEMENS)	ICT(BMS)	PLOC1-E4D-R.FW1	PLOC1-E4D-R.BFT1	PLOC1-E4D-PFT1	ESS E4D AGI1	PLOC1-E4D-OCV1	PLOC1-E4D-IR1	자동체결기-ESS Line	ESS 치수(Size)검사 장비
검사시간	2021-03-26 16:55:59	2021-03-26 17:10:06	2021-04-01 04:07:22	2021-04-02 01:26:33	2021-04-02 01:31:54	2021-04-07 22:52:49	2021-04-07 06:09:06	2021-04-06 23:31:01	2021-04-06 23:21:29	2021-04-06 14:21:15	2021-04-07 23:09:00
결과	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NG	OK

2. Case 1

- ✓ 검사 설비를 기준으로, 앞 공정에 NG 횟수에 따른 뒷 공정 NG 발생률(?)



2. Case 2

- ✓ 단일 검사 장비 內, 검사 항목별 SPEC/결과 값을 기준으로 분포도 분류



Function Test
데이터(4월)

